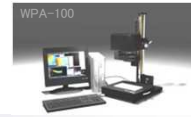
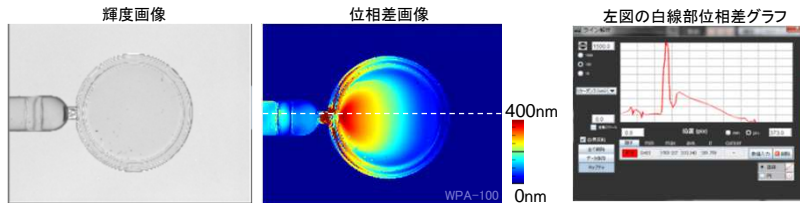


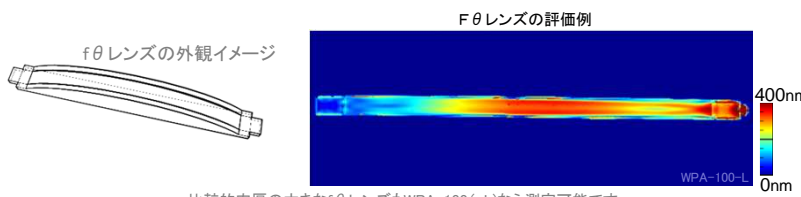
フォトリソラティス製位相差分布評価システム PA/WPAシリーズの測定事例



【レンズ】樹脂の流れ込み部(ゲート)付近に集中して発生する大きな複屈折の影響が、定量評価できます。



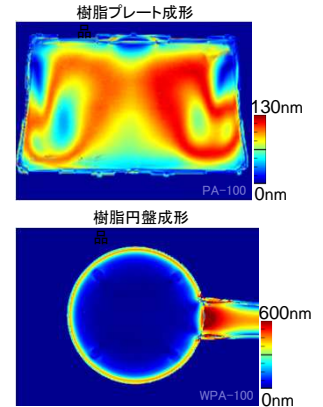
通常の観察(輝度画像)では全く見えない位相差分布が数秒で計測できます。



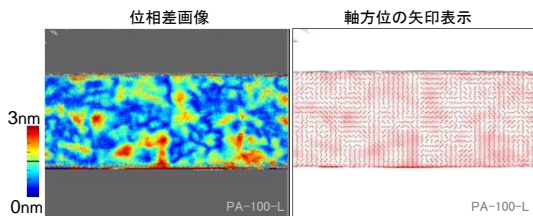
比較的肉厚の大きなfθレンズもWPA-100(-L)なら測定可能です。

【樹脂成型品】

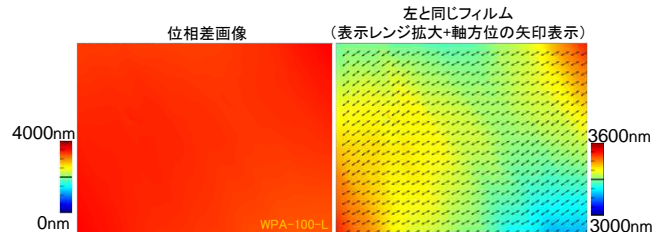
様々な樹脂成型品の評価にご利用いただいています。



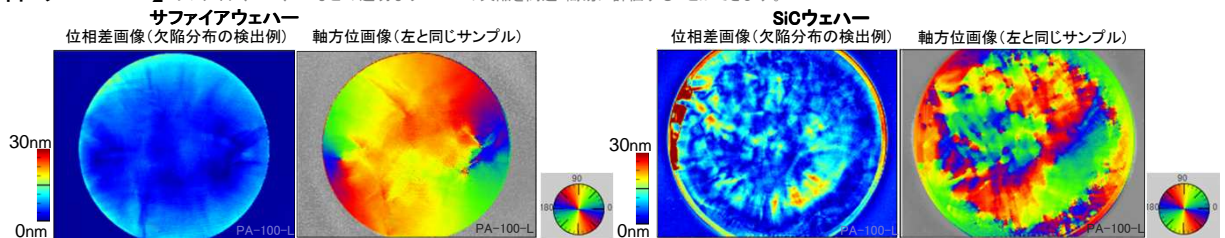
【ガラス板】数nmと極小の位相差分布も面で捉えて傾向把握できます。



【光学フィルム】一括で面測定するので、わずかな分布や欠陥を逃しません。

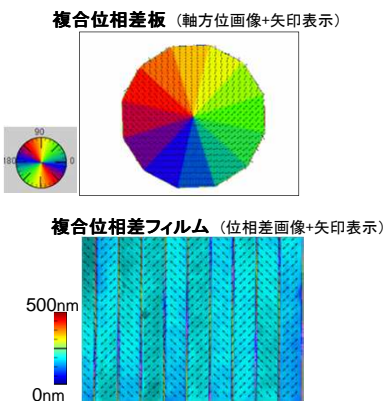


【半導体ウェハー】サファイア、GaN、SiCなどの透明なウェハーの欠陥を高速・簡単に評価することができます。



【集積位相差フィルタ】

位相差の空間分布を詳細に定量評価できます。



【その他】

PA/WPA-microなら、偏光顕微鏡の定量化ツールとしてもご利用いただけます。

